

4.3. Группа времяпролетной вторично-ионной масс-спектрометрии

Спектроскопия поверхности. Изображение поверхности. Профилирование по глубине. Исследования в широком интервале температур. Масс-спектрометр времяпролетный вторично-ионный TOF-SIMS.5 - 100P, 206147, Германия, ION-TOF GmbH. Массовый диапазон 1– 10000а.м. Температурный диапазон 150°C÷600°C. Массовое разрешение 10000. Разрешение по поверхности 60 нм. Разрешение по глубине 3 нм.

